

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 弓削哲史 副委員長 安里 彰
幹事 田村信幸・平栗滋人 幹事補佐 井上真二・岡村寛之

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 和田真一 副委員長 萱野良樹
幹事 水上雅人・鈴木健司 幹事補佐 林 優一

◎EMD 研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 2月15日(金) 13:00~17:10

会場 パナソニック企業年金基金松心会館 (<http://nenkin.jpn.panasonic.com/kaikan/map/map.html>)

議題 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

- 29th International Conference on on Electrical Contacts/64th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts の概要報告 ○澤 孝一郎・吉田 清・上野貴博(日本工大)・鈴木健司(富士電機)
- 500 VDC/10 A 抵抗性回路内で磁気吹き消しされる開離時アークの形状に対する磁石の横幅の影響
○金子裕汰・関川純哉(静岡大)
- 直流モータのブラシ及び整流子アーク痕の摺動面への復活現象 ○澤 孝一郎・渡辺克忠・上野貴博(日本工大)
- 同一周波数の強電界環境下における中波送信アンテナインピーダンス測定に関する一手法—システムの信頼性向上に向けて— ○有田 渉・清水一馬・野崎和彦・内海俊人(NHK)・白窪大司・矢野史也(NHK アイテック)・金森香子・山添雅彦(NHK)
- [招待講演] MOSFET エージングモデルを用いた回路特性劣化 SPICE シミュレーション
○田中浩治・雨宮真一郎・岡村 均・寫末政憲(モーデック)
- [招待講演] 事業継続とセキュリティインシデント封じ込めを両立させる情報システム構築 嶋田 創(名大)

◆日本信頼性学会, 継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE Electronics Packaging Society Japan Chapter, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催

☆R 研究会

【問合先】

岡村寛之(広島大)

E-mail: okamu@hiroshima-u.ac.jp

☆EMD 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月1日(金) 電通大附属図書館 [締切済] テーマ: ショートノート(卒論・修論特集)

【問合先】

萱野良樹(電通大)

TEL & FAX [042] 443-5233

E-mail: ykayano@uec.ac.jp

水上雅人(室蘭工大)

TEL & FAX [0143] 46-5307

E-mail: m-mizukami@mmm.muroran-it.ac.jp

鈴木健司(富士電機機器制御)

TEL [048] 548-1111

E-mail: suzuki-knj@fujielectric.com

林 優一(奈良先端大)

TEL [0743] 72-5390, FAX [0743] 72-5391

E-mail: yu-ichi@is.naist.jp

◎EMD 研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/> を御参照下さい。